

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/16441

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H01L21/324, H01L27/12

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H01L21/324, H01L27/12

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004
 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	UMENO S., YANASE Y., HOURAI M., SANO, M., SHIDA Y., TSUYA H., Dependence of Grown-in Defect Behavior on Oxygen Concentration in Czochralski Silicon Crystals, Jpn.J.Appl.Phys., 15 October, 1999 (15.10.99), Part 1, Vol.38, No.10, pages 5725 to 5730	1 2-19
X Y	Japan Institute of Invention and Innovation Journal of technical disclosure No. 98-477 (Sumitomo Sitix Corp.), 02 February, 1998 (02.02.98), Full text Full text	1, 5 2-4, 6-19

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.
 ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

 Date of the actual completion of the international search
 16 March, 2004 (16.03.04)

 Date of mailing of the international search report
 30 March, 2004 (30.03.04)

 Name and mailing address of the ISA/
 Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/16441

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 93/10557 A (Komatsu Electronic Metals Co., Ltd.), 27 May, 1993 (27.05.93), Full text; all drawings	1, 5
Y	Full text; all drawings & JP 5-144827 A Full text; all drawings	2-4, 6-19
X	EP 969505 A2 (Shin-Etsu Handotai Co., Ltd.), 05 January, 2000 (05.01.00), Full text; all drawings	1, 3, 7, 9, 11, 13
Y	Full text; all drawings	2, 4, 8, 10, 12, 14
A	Full text; all drawings & JP 2000-58801 A Full text; all drawings & US 6224668 B1 & KR 2000-5790 A	5, 6, 15-19
Y	JP 2000-49063 A (Shin-Etsu Handotai Co., Ltd.), 18 February, 2000 (18.02.00), Full text; all drawings (Family: none)	1-18
Y	JP 7-66149 A (Mitsubishi Materials Corp.), 10 March, 1995 (10.03.95), Full text; all drawings (Family: none)	2, 8, 12, 17
Y	JP 2001-274166 A (Wacker NSCE Kabushiki Kaisha), 05 October, 2001 (05.10.01), Full text; all drawings (Family: none)	3, 4, 9, 10, 13, 14
Y	JP 6-21033 A (Shin-Etsu Handotai Co., Ltd.), 28 January, 1994 (28.01.94), Full text; all drawings (Family: none)	5, 15
P, X	JP 2003-297840 A (Wacker Siltronic AG.), 17 October, 2003 (17.10.03), Full text; all drawings	1, 5
P, Y	Full text; all drawings (Family: none)	2-4, 6-19

P C T

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)
〔PCT18条、PCT規則43、44〕

出願人又は代理人 の書類記号 2003M027	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JPO3/16441	国際出願日 (日.月.年) 19.12.2003	優先日 (日.月.年) 14.02.2003
出願人(氏名又は名称) 三菱住友シリコン株式会社		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 3 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された磁気ディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、

第 1 図とする。 ☒ 出願人が示したとおりである。

☐ なし

☐ 出願人は図を示さなかった。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01L21/324, H01L27/12

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01L21/324, H01L27/12

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2004年
日本国実用新案登録公報	1996-2004年
日本国登録実用新案公報	1994-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	UMENO S., YANASE Y., HOURAI M., SANO M., SHIDA Y., TSUYA H., Dependence of Grown-in Defect Behavior on Oxygen Concentration in Czochralski Silicon Crystals, Jpn. J. Appl. Phys., 1999. 10. 15, Part 1, Vol. 38, No. 10, pages 5725-5730	1 2-19
X Y	発明協会公開技報公技番号98-477 (住友シチックス株式会社) 1998. 02. 02, 全文 全文	1, 5 2-4, 6-19

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

16. 03. 2004

国際調査報告の発送日

30. 3. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

綿引 隆

4M

2934

電話番号 03-3581-1101 内線 3460

C (続き) . 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	WO 93/10557 A1(小松電子金属株式会社)1993. 05. 27, 全文, 全図	1, 5
Y	全文, 全図&JP 5-144827 A, 全文, 全図	2-4, 6-19
X	EP 969505 A2(SHIN-ETSU HANDOTAI COMPANY LIMITED)2000. 01. 05, 全文, 全図	1, 3, 7, 9, 11, 13
Y	全文, 全図	2, 4, 8, 10, 12, 14
A	全文, 全図, &JP 2000-58801 A, 全文, 全図&US 6224668 B1&KR 2000-5790 A	5, 6, 15-19
Y	JP 2000-49063 A(信越半導体株式会社)2000. 02. 18, 全文, 全図(ファミリーなし)	1-18
Y	JP 7-66149 A(三菱マテリアル株式会社)1995. 03. 10, 全文, 全図(ファミリーなし)	2, 8, 12, 17
Y	JP 2001-274166 A(ワッカー・エヌエスシーイー株式会社)2001. 10. 05, 全文, 全図(ファミリーなし)	3, 4, 9, 10, 13, 14
Y	JP 6-21033 A(信越半導体株式会社)1994. 01. 28, 全文, 全図(ファミリーなし)	5, 15
PX	JP 2003-297840 A(ワッカー ジルトニック アクチエンゲゼルシャフト) 2003. 10. 17, 全文, 全図	1, 5
PY	全文, 全図(ファミリーなし)	2-4, 6-19